

管理番号	認定一部門-ENRP33-04	総枚数	10枚
------	-----------------	-----	-----

ASNITE試験事業者(環境)に係る 認定区分一覧 (第4版)

改正年月日:平成30年2月1日

作成

橋本 愛

承認

山本 健一

独立行政法人製品評価技術基盤機構
認定センター

管理番号		認定—部門—ENRP33—04		
改正履歴				
版数	制定・改正年月日 (文書番号)	改正ページ／改正理由	作成	承認
01	平成25年4月26日 平成25・04・26評基認 第001号	新規制定	敦賀 雅文	西本 光徳
02	平成25年11月8日 平成25・11・08評基認 第002号	サーベイメータ(E.06)追加及び字句の 修正	敦賀 雅文	藤間 一郎
03	平成26年5月30日 平成26・05・30評基認 第001号	アスベスト含有率測定(Z.08)追加	敦賀 雅文	藤間 一郎
04	平成30年2月1日 平成30・02・01評基認 第002号	カテゴリー「化学製品」のサブカテゴリーに「70.成形品・部材」及び「80.製造 工程・製品放散物質」を追加 一部用語の修正	橋本 愛	山本 健一

ENRP33-04
ASNITE公表用文書

ASNITE試験事業者(環境)に係る
認定区分一覧
(第4版)

平成30年2月1日

独立行政法人製品評価技術基盤機構
認定センター

ASNITE試験事業者(環境)に係る認定区分一覧

製品評価技術基盤機構認定制度(ASNITE)における環境分野の試験事業に係る「認定区分」は、表1 認定区分(分類A:分野)に定めるカテゴリ及びサブカテゴリと表2 認定区分(分類B:試験技術)に定める試験技術を組み合わせたものとする。

なお、試験方法は原則として各省庁告示、各省庁マニュアル、ISO 等の公定法とする。

表1 認定区分(分類A:分野)

認定区分(分類A:分野)		例示	
カテゴリー	サブカテゴリー	試験対象	試験項目
1. 環境	10. 大気	環境大気、 排ガス等	各成分濃度、ダイオキシン類、 <u>粉じん(特定粉じんを除く)</u> 、 <u>放射性物質</u> 等
	20. 水質	環境水、排水、 底質等	各成分濃度、ダイオキシン類、 <u>放射性物質</u> 等
	30. 土壌	土壌等	各成分濃度、ダイオキシン類、 <u>放射性物質</u> 等
	40. 廃棄物	産業廃棄物、 焼却灰、汚泥等	各成分濃度、ダイオキシン類、 <u>放射性物質</u> 等
	99. その他		
2. 化学製品	10. 無機	無機薬品、無機 着色顔料、無機 ガス等	各成分濃度等
	20. 有機	有機薬品、有機 着色顔料、燃料 等	各成分濃度等
	30. 高分子	プラスチック、 ゴム等	各成分試験、各特性試験等
	40. 金属	鉄、非鉄金属等	各成分試験等
	50. 水	超純水、原水、 <u>浄水</u> 等	各成分濃度等
	60. 標準物質(試験)	標準物質(試験) 等	各成分濃度等
	<u>70. 成形品・部材</u>	<u>RoHS 指令対象製 品</u>	<u>各成分試験等</u>
	<u>80. 製造工程・ 製品放散物質*</u>	<u>放散物質</u>	<u>各成分試験等</u>
	99. その他		

*製造工程又は製品から排出される揮発性有機化合物、粉じん等の放散物質をいう。

表2 認定区分(分類B:試験技術)

認定区分(分類 B:試験技術)	Code No.
スペクトル分析	A.00
原子吸光分析法	A.01
発光分光分析法(ICP/AES を除く)	A.02
ICP/AES(誘導結合プラズマ発光分光分析法)	A.03
ICP/MS(誘導結合プラズマ質量分析法)	A.04
蛍光分析法・りん光分析法	A.05
化学発光法	A.06
赤外・近赤外分析法	A.07
紫外・可視吸光光度分析法	A.08
X線回折法	A.09
蛍光X線分析法	A.10
NMR(核磁気共鳴分光分析法)	A.11
ESR(電子スピン共鳴分光法)	A.12
質量分析法	A.13
放射化分析法	A.14
ラマン分光法	A.15
マイクロ/表面分析	B.00
AES(オージェ電子分光法)	B.01
PIXE(粒子線励起X線分析法)	B.02
XPS(X線光電子分光法)	B.03
SIMS(2次イオン質量分析法)	B.04
RHEED(反射高速電子線回折法)	B.05
XMA(X線マイクロアナリシス)	B.06
粒子物性	C.00
密度	C.01
粒度	C.02
空隙度	C.03
コリゲーション	C.04
顕微鏡分析	D.00
光学顕微鏡	D.01
－位相差顕微鏡	
－偏光顕微鏡	
－化学顕微鏡	

認定区分(分類 B: 試験技術)	Code No.
TEM(透過型電子顕微鏡)	D.02
SEM(走査型電子顕微鏡)	D.03
STM(走査トンネル顕微鏡)	D.04
クロマトグラフィー	E.00
GC(ガスクロマトグラフィー)	E.01
LC(液体クロマトグラフィー)	E.02
ゲル浸透クロマトグラフィー	E.03
IC(イオンクロマトグラフィー)	E.04
GC/MS(ガスクロマトグラフィー質量分析法)	E.05
LC/MS(液体クロマトグラフィー質量分析法)	E.06
薄層及びペーパークロマトグラフィー	E.07
電気泳動法	E.08
超臨界流体クロマトグラフィー	E.09
化学分析	F.00
重量分析	F.01
容量分析(滴定法)	F.02
定性分析	F.03
FIA(フローインジェクション分析)	F.04
COD(化学的酸素要求量)	F.05
物理化学試験	G.00
蒸留試験	G.01
引火点	G.02
密度	G.03
粘度	G.04
電気化学分析	H.00
ボルタンメトリー	H.01
電解重量分析法	H.02
電量分析(定電位)	H.03
電量滴定法	H.04
イオン電極法(含む pH 測定)	H.05

認定区分(分類 B: 試験技術)	Code No.
放射能・放射線測定	J.00
液体シンチレーション計測	J.01
アルファ線スペクトロメトリー	J.02
ベータ線計測	J.03
ガンマ線スペクトロメトリー	J.04
放射化学分析	J.05
サーベイメータ	J.06
熱分析	K.00
DTA(示差熱分析)	K.01
DSC(示差走査熱量測定)	K.02
熱量分析	K.03
TGA(熱重量分析)	K.04
TMA(熱機械分析)	K.05
生物学的試験	M.00
BOD(生物化学的酸素要求量)	M.01
生物発光法	M.02
酵素免疫法	M.03
微生物定量法	M.04
酵素法	M.05
バイオオートグラフ法	M.06
PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)法	M.07
物理試験	N.00
加工性試験	N.01
－加工試験,成形加工試験	
成形特性試験(レオロジー)	N.02
－粘弾性試験、メルトインデクサー	
機械的特性試験	N.03
－引張試験、耐衝撃性、硬さ	
－屈曲試験	
耐久性試験	N.04
－耐候性、耐熱、摩耗・破壊	
－耐薬品性、塩水噴霧試験	
－熱衝撃試験	

認定区分(分類 B: 試験技術)	Code No.
電気特性試験	N.05
－絶縁破壊電圧、耐電圧	
熱的性質試験	N.06
－熱変形温度、ビカッ軟化	
光学的・物理特性試験	N.07
－色測定、透明性測定、滑り性	
－ガス透過性	
粘性試験	N.08
塗料試験	P.00
塗料の性状・安定性に関する試験	P.01
塗膜の形成機能に関する試験	P.02
塗膜の視覚特性に関する試験	P.03
塗膜の機械的性質に関する試験	P.04
塗膜の化学的性質に関する試験	P.05
塗膜の長期耐久性に関する試験	P.06
塗膜劣化の評価に関する試験	P.07
粉体塗料に関する試験	P.08
塗料成分試験	P.09
その他	Z.00
TOD(全酸素要求量)	Z.01
TOC(全有機炭素)	Z.02
TOX(全有機ハロゲン)	Z.03
試金法	Z.04
元素分析	Z.05
微粒子測定	Z.06
騒音測定	Z.07
アスベスト含有率測定	Z.08

附則

この規程は、平成25年4月26日から適用する。

附則

この規程は、平成25年11月8日から適用する。

附則

この規程は、平成26年5月30日から適用する。

附則

この規程は、平成30年2月1日から適用する。

ASNITE 試験事業者(環境)に係る認定区分一覧(第4版)
改正ポイント

主な改正内容

- ◆表1 認定区分(分類A:分野)中、カテゴリ「化学製品」に以下のサブカテゴリを追加いたしました。
これらの区分は、RoHS 指令関係試験及び放散物質試験に係るサブカテゴリを個別に規定したものです。
(追加したサブカテゴリ)
 - 70.成形品・部材
 - 80.製造工程・製品放散物質
- ◆表2 一部用語の修正

内容の変更を伴う改正箇所には、下線を付しています。